Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/724,374	BAE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Rin A Lee	1713	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
524	426	02-09-572	n
524	567		
524	569 424		
524 524	424	7	
		,	
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			-

INI	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
	1			

(INCLUDING SEAR)	DATE	EXMR
EAST yearl	05-06-2005	m